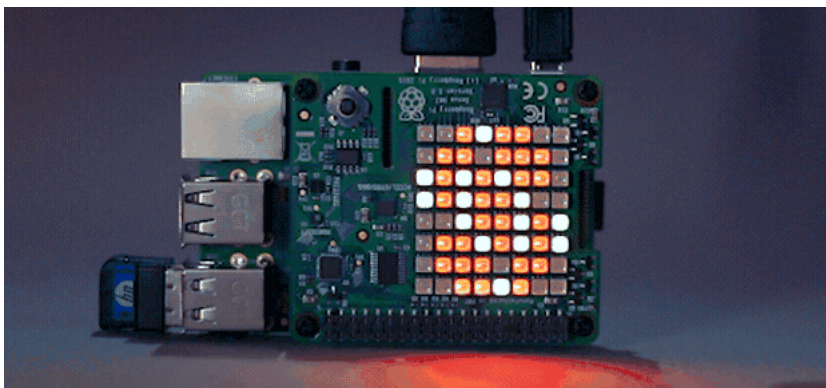


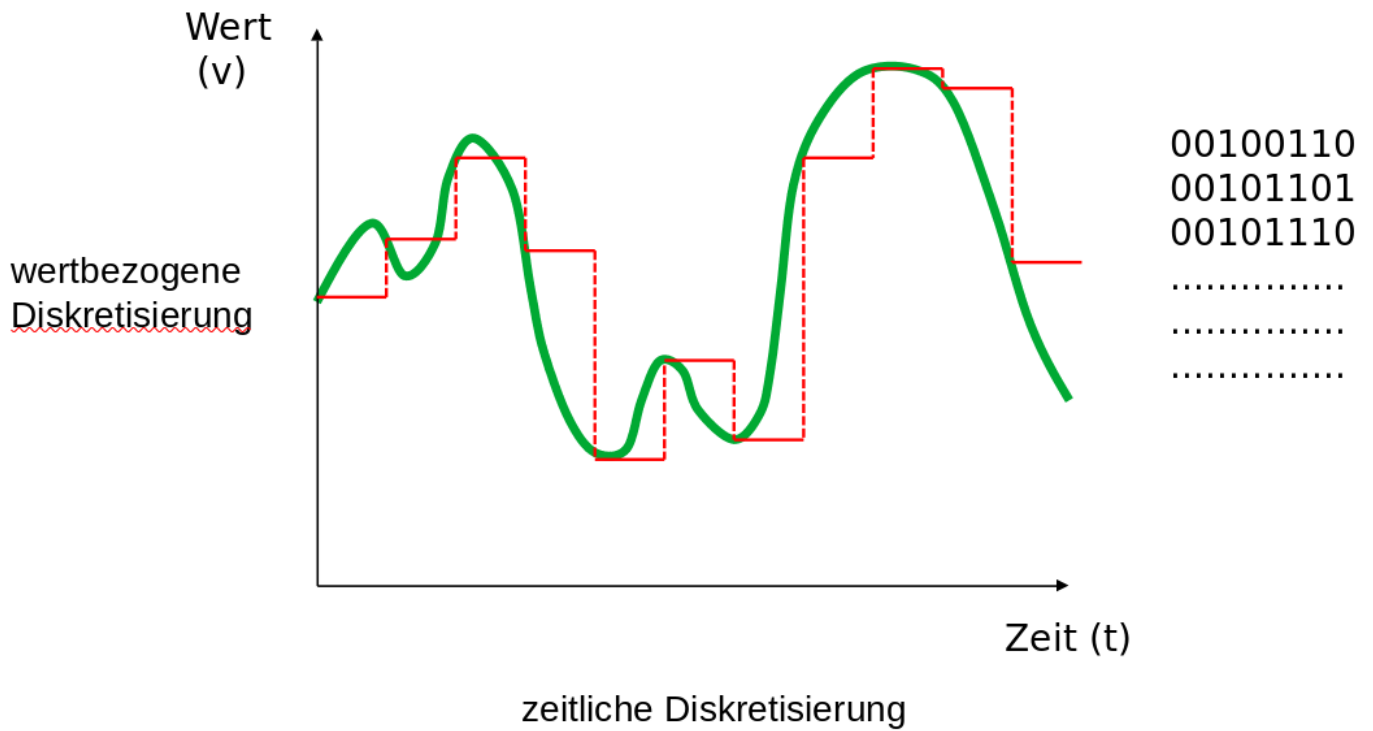
# Analog-Digital-Wandler

Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	Vorlesung Digitale Systeme
Semester	Sommersemester 2022
Hochschule:	Technische Universität Freiberg
Inhalte:	Beschreibung des Aufbaus des Analog-Digital-Wandlers und der Implementierung in der Atmega Familie
Link auf den GitHub:	<a href="https://github.com/TUBAF-lfi-LiaScript/VL_DigitaleSysteme/blob/main/lectures/04_AnalogDigitalWandler.md">https://github.com/TUBAF-lfi-LiaScript/VL_DigitaleSysteme/blob/main/lectures/04_AnalogDigitalWandler.md</a>
Autoren	Sebastian Zug, Karl Fessel & Andr� Dietrich



## Motivation

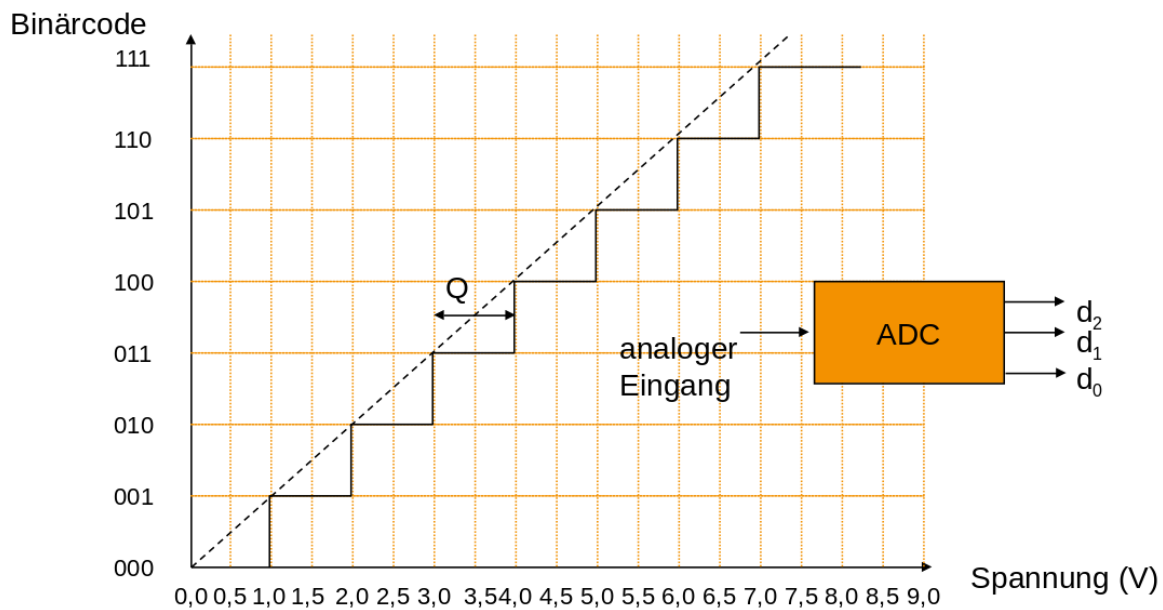
In der vorangegangenen Vorlesung sprachen wir insbesondere  ber die Erfassung von digitalen Signalen. Eine Erfassung von analogen Werten ist allerdings notwendig, um Ph nomene der Umgebung mit dem notwendigen Detailgrad beobachten zu k nnen.



Dabei wird das zeit- und wertkontinuierliche Eingangssignal in eine zeit- und wertdiskrete Darstellung überführt.

Die Idee besteht darin einem Spannungswert einer Zahlenrepräsentation zuzuordnen, die einen Indexwert innerhalb eines beschränkten Spannungswert repräsentiert.

	minimaler Wert		maximaler Wert					
Analog	0V	← Wert →	8V					
Digital	0   1   2   3   4   5   6   7							3 Bit Auflösung
	0   2   3   4							2 Bit
	0   1							1 Bit



Daraus ergibt sich die zentrale Gleichung für die Interpretation des Ausgabens eines Analog-Digital-Wandlers

$$ADC = \frac{V_{in}}{V_{ref}} ADC_{res}$$

oder

$$\frac{ADC \cdot V_{ref}}{ADC_{res}} = V_{in}$$

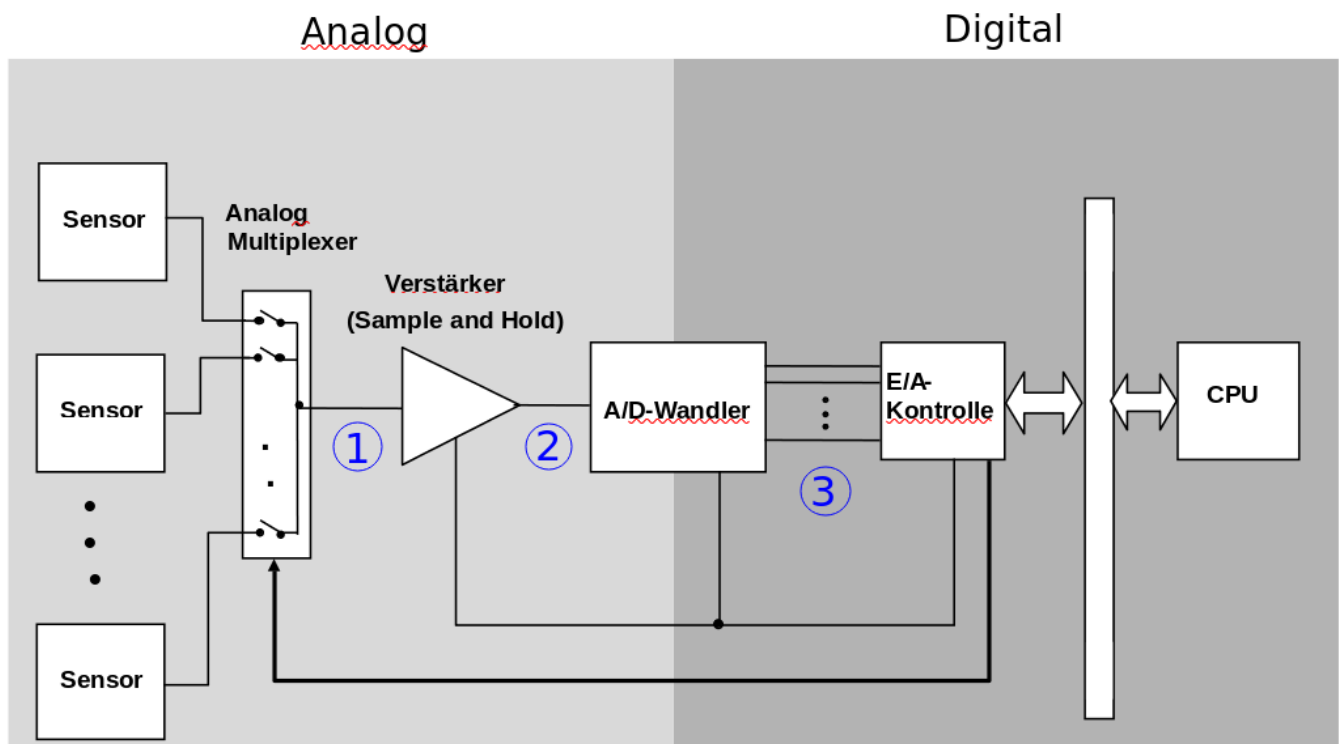
Für unser Beispiel aus der Grafik zuvor bedeutet die Ausgabe von "5" bei einem 3-Bit-Wandler, also

$$\frac{5 \cdot 8V}{2^3} = 5V$$

Der potentielle Quantisierungsfehler  $Q$  beträgt

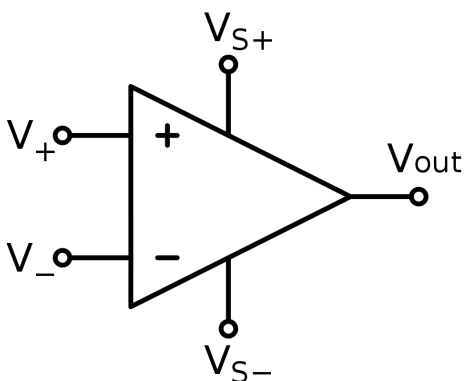
$$Q = \frac{8V}{2^3} = 1V$$

Dabei erfolgt die Wandlung in zwei generellen Schritten. Zunächst wird das Signal zeitlich diskretisiert und darauffolgend wertbezogenen gewandelt.

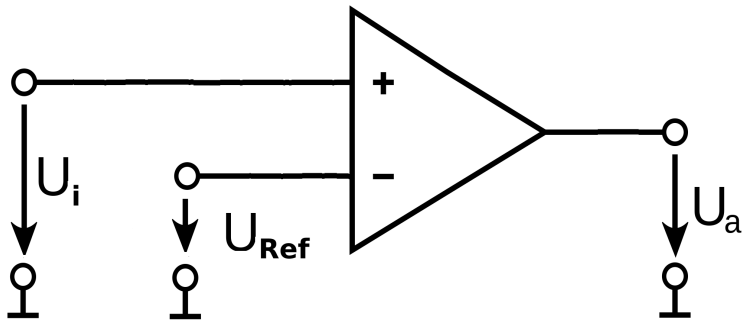


## Analog Komparator

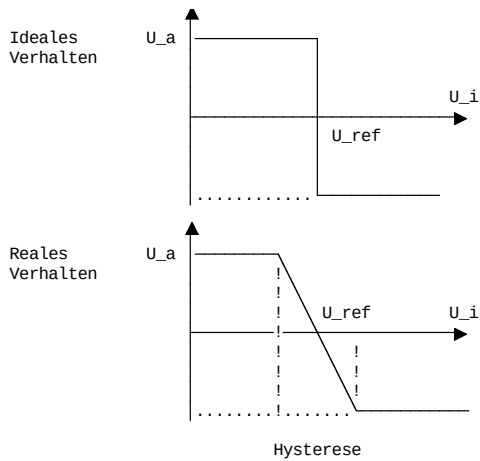
Ein Komparator ist eine elektronische Schaltung, die zwei Spannungen vergleicht. Der Ausgang zeigt in binärer/digitaler Form an, welche der beiden Eingangsspannungen höher ist. Damit handelt es sich praktisch um einen 1-Bit-Analog-Digital-Umsetzer.



Symbol eines Operationsverstärkers

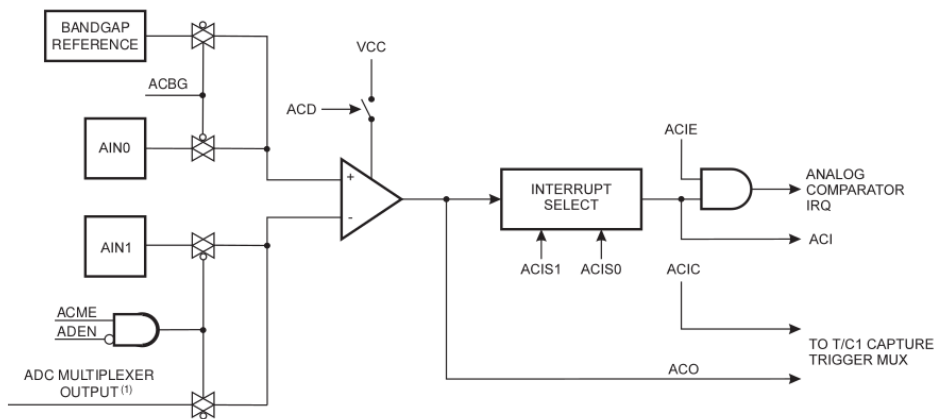


Grundsätzliche Beschaltung eines Operationsverstärkers bei der Verwendung als ADC <sup>[WikipediaOmegatron]</sup>



Im AVR findet sich ein Komparator, der unterschiedliche Eingänge miteinander vergleichen kann: Für "+" sind dies die **BANDGAP Reference** und der Eingang **AIN0** und für "-" der Pin **AIN1** sowie alle analogen Eingänge.

**Figure 23-1. Analog Comparator Block Diagram<sup>(2)</sup>**



Comperator Konfiguration im ATmega <sup>[AtmelHandbuch]</sup>

Die grundlegende Konfiguration erfolgt über die Konfiguration der Bits / Register :

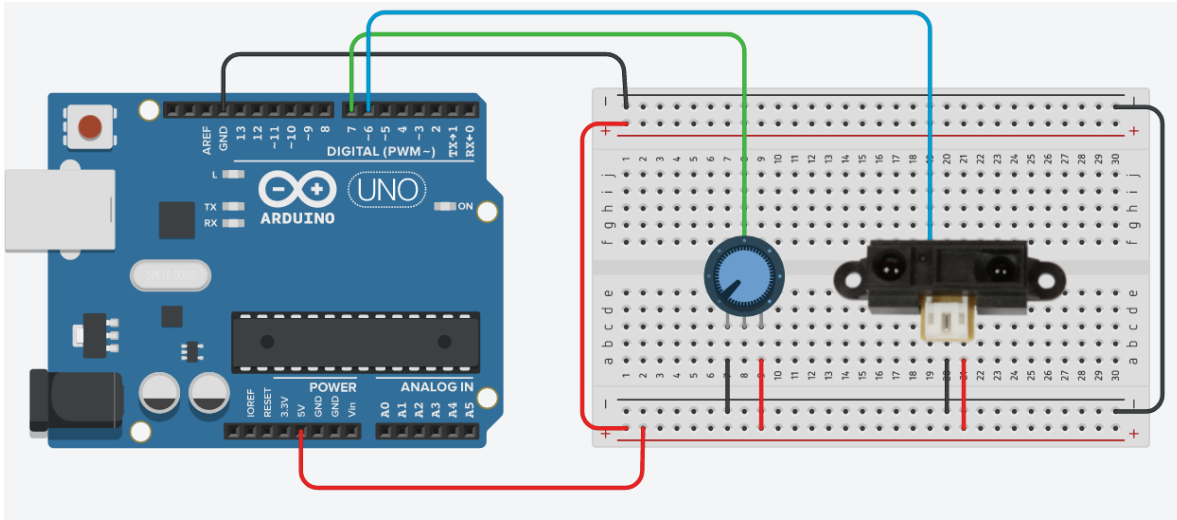
Bits	Register	Bedeutung
ACBG	ACSR	Analog Comparator Bandgap Select
ACME	ADCSRB	Analog Comparator Multiplexer Enable - Bit im Register
ADEN	ADCSRA	Analog Digital Enable
MUX2, MUX1, MUX0	ADMUX	Multiplexer Analog input

Dazu kommen noch weitere Parameterisierungen bezüglich der Interrupts, der Aktivierung von Timerfunktionalität oder der Synchronisierung.

Weitere Erläuterungen finden Sie im Handbuch auf Seite

**Aufgabe:** An welchen Pins eines Arduino Uno Boards müssen Analoge Eingänge angeschlossen werden, um die zwei Signale mit dem Komparator zu vergleichen. Nutzen Sie den Belegungsplan (Schematics) des Controllers, der unter [Link](#) zu finden ist.

Ein Beispiel für den Vergleich eines Infrarot Distanzsensors mit einem fest vorgegebenen Spannungswert findet sich im *Example* Ordner der Veranstaltung.



```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>

int main()
{
    ADCSRB = (1<<ACME);
    DDRB = (1<<PB5);

    while(1)
    {
        if (ACSR & (1<<ACO)) /* Check ACO bit of ACSR register */
            PORTB &= ~(1 << PB5); /* Then turn OFF PB5 pin */
        else /* If ACO bit is zero */
            PORTB = (1<<PB5); /* Turn ON PB5 pin */
    }
}
```

**Einschränkung von Tinkercad** The ANALOG COMPARE feature, which is a possible interrupt source on the mega328P, does not work at all (output compare result ACO in register ACSR does not seem to change, no matter what voltages are presented at pins 6, 7).

Die Demo folgt in der Übung

[AtmelHandbuch] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Seite 243, [Link](#)

[WikipediaOmegatron] Wikipedia, Autor Omegatron - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=983276>

## Analog Digital Wandler

Voraussetzung für den Wandlungsprozess ist die Sequenzierung des Signals. Mit einer spezifischen Taktrate wird das kontinuierliche Signal erfasst.

Wie sollte die Taktrate für die Messung denn gewählt werden?

#### PrintSampleResults.py

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.optimize import curve_fit
4
5 # Generierung der "Realen Messungen"
6 f = 40 # Hz
7 tmin = -0.3
8 tmax = 0.3
9 t = np.linspace(tmin, tmax, 400)
10 s = np.cos(2*np.pi*f*t)
11
12 # Abtastung mit einer Frequenz kleiner der Grenzfrequenz
13 T = 1/35.0
14 nmin = np.ceil((tmin) / T)
15 nmax = np.floor((tmax) / T)
16 n = np.arange(nmin, nmax) * T
17 y = np.cos(2*np.pi*f*n)
18
19 # Fitting eines Cosinussignals anhand der Messungen
20 def test(x, a):
21     return np.cos(a * x)
22
23 # Berechnung des Signalverlaufes mit der geschätzten Periodendauer
24 param, param_cov = curve_fit(test, n, y)
25 ans = np.cos(param[0]*t)
26
27 # Ausgabe
28 fig, ax = plt.subplots()
29 ax.plot(t, s)
30 ax.plot(n, y, '.', markersize=8)
31 ax.plot(t, ans, '--', color='red', label=f"Estimated Signal")
32 ax.grid(True, linestyle='-.')
33 ax.tick_params(labelcolor='r', labelsizes='medium', width=3)
34
35 plt.show()
36
37 plot(fig) # <- this is required to plot the fig also on the LiaScript
    canvas
```

Wenn ein kontinuierliches Signal, das keine Frequenzkomponenten hat, die über einer Frequenz  $f_c$  liegen mit einer Häufigkeit von größer  $2f_c$  abgetastet wird, kann das Originalsignal aus den gewonnenen Punkten unverzerrt rekonstruiert werden.

Falls dieses Kriterium nicht eingehalten wird, entstehen nichtlineare Verzerrungen, die auch als Alias-Effekt bezeichnet werden (vgl. Python Beispiel). Die untere Grenze für eine Alias-freie Abtastung wird auch als *Nyquist-Rate* bezeichnet.

Als Erklärung kann eine Darstellung des Signals im Frequenzbereich dienen:

## Flashwandler

Vorteil

- Hohe Geschwindigkeit

Nachteil

- Energieverbrauch größer
- Hardwareaufwand für höhere Auflösungen

<https://www.youtube.com/watch?v=x7oPVWLD59Y>

## Sequenzielle Wandler

Sequenzielle Wandler umgehen die Notwendigkeit mehrerer Komparatoren, in dem das Referenzsignal variabel erzeugt wird.

Dafür ist allerdings ein Digital-Analog-Wandler nötig, der die Vergleichsspannung ausgehend von einer digitalen Konfiguration vornimmt.

## Zählverfahren

### Vorteil

- sehr hohe Auflösungen möglich
- Schaltung einfach umsetzbar – kritisches Element DAC/Komperator

### Nachteil

- Variierende Wandlungsdauer
- langsam (verglichen mit dem Flashwandler)

## Sukzessive Approximation/Wägeverfahren

### Vorteil

- Gleiche Wandlungsdauer

## Herausforderungen bei der Wandlung

### Fehlertypen

- Quantisierungsfehler sind bedingt durch die Auflösung des Wandlers
- Offsetfehler ergeben sich aus einer Abweichung der Referenzspannung und führen zu einem konstanten Fehler.
- Verstärkungsfehler im Analog-Digitalwandler wirken einen wertabhängigen Fehler.
- Der Linearitätsfehler ist die Abweichung von der Geraden. Linearitätsfehler lassen sich nicht abgleichen.

**Merke:** Die Fehlerparameter hängen in starkem Maße von der Konfiguration des Wandlers (Sample Frequenz, Arbeitsbreite, Umgebungstemperatur) ab!

Datenblatt eines 8 Bit Wandlers der TLC0831 <sup>[TIDatenblatt]</sup>

### Referenzspannung

Eine Herausforderung liegt in der stabilen Bereitstellung der Referenzspannung für den Analog-Digital-Wandler.

## Parameter eines Analog-Digital-Wandlers

- Auflösung
- Messdauer
- Leistungsaufnahme
- Stabilität der Referenzspannung
- Unipolare/Bipolare Messungen
- Zahl der Eingänge
- Ausgangsinterfaces (parallele Pins, Bus)
- Temperaturabhängigkeit und Rauschverhalten (Gain, Nicht-Linearität, Offset)

---

[TIDatenblatt] Firma Texas Instruments, Datenblatt AD-Wandler 8 Bit DIL-8, TLC0831, TLC0831IP

## Umsetzung im AVR

Handbuch des Atmega328p	Bedeutung
10-Bit Auflösung	
0.5 LSB Integral Non-Linearity	maximale Abweichung zwischen der idealen und der eigentlichen analogen Signalverlauf am Wandler
+/- 2 LSB Absolute Genauigkeit	Summe der Fehler inklusive Quantisierungsfehler, Offset Fehler etc. (worst case Situation)
13 - 260µs Conversion Time	Die Dauer der Wandlung hängt von der Auflösung und der der vorgegebenen Taktrate ab.
Up to 76.9kSPS (Up to 15kSPS at Maximum Resolution)	
0 - V CC ADC Input Voltage Range	Es sind keine negativen Spannungen möglich.
Temperature Sensor Input Channel	
Sleep Mode Noise Canceler	Reduzierung des Steuquellen durch einen "Sleepmode" für die CPU

Strukturdarstellung des AD-Wandlers im ATmega [HandbuchAtmega]

### Trigger für den Wandlung

Grundsätzlich sind 3 Modi für die Wandlung möglich:

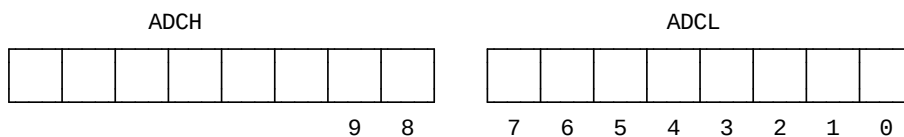
- Programmgetriggerte Ausführung der Wandlung
- Kontinuierliche Wandlung
- ereignisgetriebener Start

## Trigger des AD-Wandlers im ATmega [HandbuchAtmega]

Zeitlicher Verlauf einer AD-Wandlung [HandbuchAtmega]

## Ergebnisregister

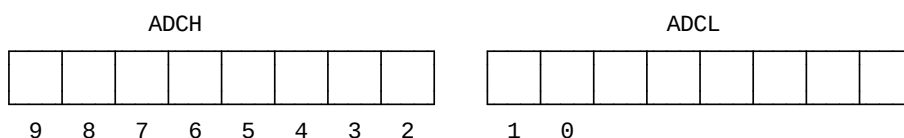
Die Atmega Prozessoren bieten eine Auflösung von 10Bit oder 8Bit für die analogen Wandlungen. Entsprechend stehen zwei Register `ADCL` und `ADCH` für die Speicherung bereit. Standardmäßig (d.h. `ADLAR == 0`) werden die niederwertigsten 8 im Register `ADCL` bereitgehalten und die zwei höherwertigsten im Register `ADCH`.



Das Ergebnis ergibt sich dann zu

```
uint8_t theLowADC = ADCL
uint16_t theTenBitResults = ADCH<<8 | theLowADC;
```

Ist keine 10-bit Genauigkeit erforderlich, wird diese Zuordnung durch das Setzen des **ADLAR** Bits im **ADMUX** Register angepasst. Auf diese Weise kann das ADC Ergebnis direkt als 8 Bit Zahl aus **ADCH** ausgelesen werden.





**Merke:** Immer zuerst ADCL und erst dann ADCH auslesen.

Beim Zugriff auf ADCL wird das ADCH Register gegenüber Veränderungen vom ADC gesperrt. Erst beim nächsten Auslesen des ADCH-Registers wird diese Sperre wieder aufgehoben. Dadurch ist sichergestellt, dass die Inhalte von ADCL und ADCH immer aus demselben Wandlungsergebnis stammen, selbst wenn der ADC im Hintergrund im Free-Conversion-Mode arbeitet.

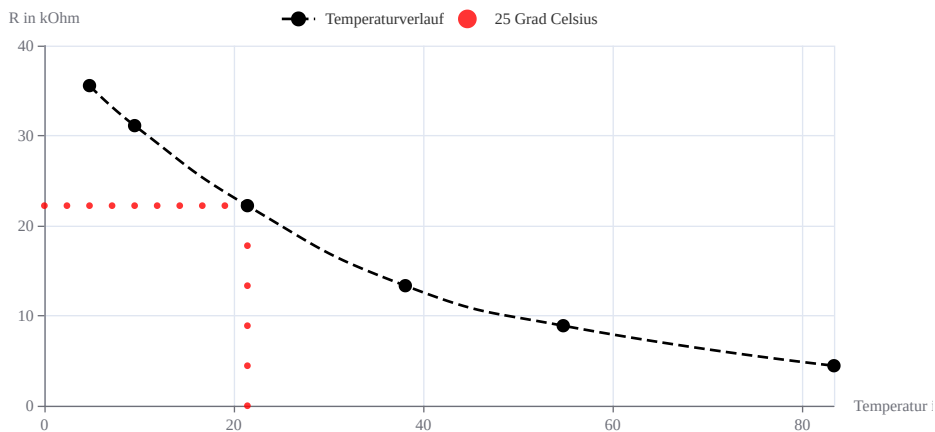
[HandbuchAtmega] Firma Microchip, megaAVR® Data Sheet, Seite 247, [Link](#)

## Beispiele

### Beispiel 1 - Heißleiter

NTC-Widerstände (*Negative Temperature Coefficient*) werden zur Messung der Temperatur eingesetzt. Wichtigster Kennwert eines NTCs ist der Nennwiderstand R25 bei einer Nenntemperatur von 25 °C.

#### NTC-Widerstand Kennlinie



$$\frac{R_{NTC}}{R_1} = \frac{U_{NTC}}{U_{R1}} = \frac{U_{NTC}}{(U_{ges} - U_{NTC})}$$
$$R_{NTC} = R_1 \cdot \frac{U_{NTC}}{(U_{ges} - U_{NTC})}$$

Wenn wir davon ausgehen, dass die Referenzspannung des AD-Wandlers gleich  $U_{ges}$  ist, generieren wir eine digitale Repräsentation  $U_{NTC_d}$  entsprechend

$$U_{NTC_d} = U_{NTC} \cdot \frac{U_{ges}}{ADC_{resolution}}$$

Wie interpretieren wir somit einen beispielhaften Wert von 628 am Ende des Wandlungsprozesses?

$$U_{NTC} = U_{NTC_d} \cdot \frac{ADC_{resolution}}{U_{ges}}$$

Mit diesem Spannungswert können wir nun den zugrundeliegenden Widerstand berechnen und letztendlich die Temperatur.

### Beispiel 2 - Lesen eines Analogen Distanzsensors

Für das Beispiel wird der AtMega2560 verwendet, der eine interne Referenzspannung von 2.56 V anstatt der des AtMega328 von 1.1 V bereit stellt.

Referenzsystem des Analog-Digitalwandlers [\[HandbuchAtmega\]](#)

Die Bedeutung ergibt sich beim Blick ins Datenblatt des Sensors GP2D, dessen Maximalwertausgabewert liegt bei etwa 2.55V

```
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL // 16 MHz clock speed
#endif

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int readADC(int channel) {
    int i; int result = 0;
```

The first ADC conversion result after switching reference voltage source may be inaccurate, and the user is advised to discard this result. Handbuch Seite 252

### Beispiel 3 - Temperaturüberwachung des Controllers

The temperature measurement is based on an on-chip temperature sensor that is coupled to a single ended ADC8 channel. Selecting the ADC8 channel by writing the MUX3...0 bits in ADMUX register to "1000" enables the temperature sensor. The internal 1.1V voltage reference must also be selected for the ADC voltage reference source in the temperature sensor measurement. When the temperature sensor is enabled, the ADC converter can be used in single conversion mode to measure the voltage over the temperature sensor. Handbuch Seite 256

```
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL // 16 MHz clock speed
#endif

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

double getTemp(void)
{
    unsigned int wADC;
    double t;

    // Set the internal reference and mux.
    ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<MUX3);
    ADCSRA |= (1<<ADEN); // enable the ADC

    // wait for voltages to become stable.
    delay(20);

    // Start the ADC
    ADCSRA |= (1<<ADSC);

    // Detect end-of-conversion
    while (ADCSRA & (1<<ADSC));
    wADC = ADCW;

    // The offset of 324.31 could be wrong. It is just an indication.
    t = (wADC - 324.31) / 1.22;

    // The returned temperature is in degrees Celsius.
    return (t);
}
```

## Aufgaben

- ☐ Reimplementieren Sie die Nutzung des Temperatursensors aus Ihrer "Bastelbox", so dass bis auf die Serielle Kommunikation keine Arduino-Bibliotheken mehr genutzt werden.
- ☐ Nutzen Sie die Infrarot-Distanzsensoren aus Ihrer Box, um eine Entfernungsmessung zu Implementieren. Für die Ausgabe sollten Sie beide Varianten der Linearisierung nutzen - Look-up-Table und Funktionsdarstellung.